Development of a photocathode test bench using a cryo-pump and a NEG pump

Daisuke Kubo #,A), Masao Kuriki^{A)}, Hokuto Iijima^{A)}, Yuki Masumoto^{A)}, Nobuyuki Nishimori^{B)}, Masahiro Yamamoto^{C)},

^{A)} Grad. Advanced Science of Matter, Hiroshima Univ., Higashi-Hiroshima, Hiroshima, Japan

^{B)} JAEA, 2-4 Shirakata-Shirane, Tokai, Ibaraki

^{C)} KEK, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki

Abstract

The Beam Physics Laboratory of Hiroshima University studys photo-cathode for future acceleators by using a photocathode test bench. It aims to develop a cathode with the higher quantum efficiency and longer-lifetime. GaAs with Negative Electron Affinity (NEA) surface is one of the best cathode among the advanced cathode matrials. The NEA surface is essential to activate it as an electron source. It is well known that the NEA GaAs photo-cathode needs extremely high vacuum, because it is easily damaged. To study the detail process of the cathode property degradation by the damage, we construct a photo-cathode test bench with an extremely high vacuum quality based on a cryo-pump (2700l/s) and a NEG pump (1200l/s). The vacuum chamber is made of titanium (TP340) for low outgassing rate. We alredy obtain 1.6E-9Pa only with the cryo-pump. In this article, the test bench is briefly explained and the results of the vacuum test is presented.

クライオポンプと NEG ポンプを使用した光陰極試験装置開発

1. はじめに

エネルギー回収型リニアック(ERL)^[1]を利用した、 次世代放射光源の電子源は、放射光源全体の性能を 決める重要なコンポーネントであり、大電流 100mA、低エミッタンス 0.1mm-mrad という厳しい 性能を要求されている。上記の要求性能を満たす電 子源として、現在までに提案されている唯一の方式 が DC 電子銃と NEA 半導体陰極を組み合わせた方 式である。しかし NEA 表面は、光陰極から引き出 された電子ビームと、残留ガスの衝突によって生成 される陽イオンが光陰極表面に逆流することで簡単 に破壊されてしまう。そのために NEA 光陰極は大 電流でビームを引き出した場合に寿命が制限されて しまう。実際に広島大学が過去に行った実験からも、 NEA-GaAs 光陰極の寿命は真空度に強く依存してい ることが分かっている^[2]。この実験は広島大学に既 存の光陰極試験装置で行われており、典型的な測定 中の真空度は 5.0×10⁻⁹Pa である。我々は、NEA 光 陰極の寿命劣化の詳細を解明し、寿命を延ばすため に新しい光陰極試験装置を開発している。寿命劣化 の詳細を解明するための装置に必要な条件として、 実験を様々な条件で幅広い値で行えることが必要で ある。その中でも真空度は特に重要なパラメーター である。例えば、様々な成分のガスを導入して NEA 光陰極の劣化を観測する場合、導入されたガ ス圧に比べて、残留ガスによる基本的な真空度は十 分小さい値をとっていることが必要である。それと ともに、既存の装置よりも低い真空度で光陰極の試 験を行い、現在観測されている光陰極の寿命よりも 長いことを確認することも主要な目標である。この

ような目的から我々は極高真空中(<1×10⁹Pa)で光 陰極の性能試験を行うことができる、新しい光陰極 試験装置を開発している。

2. 光陰極試験装置の開発

図 1 に我々が開発中の新しい光陰極試験装置 (Hiroshima University Electron Source No.1: HUES1)の 概要図を示す。



HUES1 は主にガンチェンバーとプリパレーショ ンチェンバーで構成される。ガンチェンバーの持つ 役割として最も重要な事は、極高真空下で光陰極の 寿命測定を行うことである。そのために、ガンチェ ンバーを化学研磨されたチタンで製作した。チタン は一般的に真空容器製作の際に用いられるステンレ スよりガス放出が 2~3 桁小さいとされている^[3]。 それと共に真空排気装置として、NEG ポンプ (1200l/s)とクライオポンプ(2700l/s)を使用する。

広島大学に既存の光陰極試験装置は、一つの真空 容器の中で NEA 活性化と光陰極試験を行っている。

[#] daisuke-kubo@hiroshima-u.ac.jp

真空排気は NEG ポンプ(3101/s)とイオンポンプ (160l/s)を用いて行い、到達真空度は 5.0×10⁻⁹Pa で ある。超高真空を得るために NEG ポンプとイオン ポンプを組み合わせて真空排気を行うことは広く知 られている。NEG ポンプは特に残留ガスの主成分 である水素に対して高い排気速度を持つが、一方で 希ガスやメタンなどは排気できない。従来はイオン ポンプによりこれらを排気していたが、イオンポン プはその動作原理からこの様な超高真空領域では排 気速度を持たないと考えられている。そこで我々は イオンポンプの代わりに、極高真空下においても適 度な排気速度が期待できるクライオポンプを使用す る^[4]。クライオポンプは 80K 以下まで冷却可能な 1 段ステージと 10~12K まで冷却可能な 2 段ステー ジを持つ。18K で H₂、He、Ne の除く分子の飽和蒸 気圧は 1×10⁻¹¹Pa 以下であり、H₂、He、Ne につい ても 20K 以下に冷やされた多孔質の吸着剤で排気 する事が可能である。一般的なクライオポンプは、 ポンプケースをステンレスで製作されているが、 我々はポンプケース自身からのガス放出も抑えるた めに特別にチタンで製作されたものを用いる。

ガンチェンバーには粗排気を行うために、 TMP(300l/s)とスクロールポンプを取り付けている。 粗排気系とガンチェンバーは ICF152 のオールメタ ルアングルバルブで仕切り、ベーキング中はアング ルバルブを通して TMP で排気を行う。真空計測に は 1×10⁻¹⁰Pa まで計測可能なエクストラクターゲー ジ(EXT)と 2×10⁻⁷Pa まで計測可能なコールドカソー ドゲージ(CCG)を用いる。その他にも、電子ビーム 引き出しに必要なレーザー光を照射するための ICF70 のビューポートなども取り付けることが可能 である。

プリパレーションチェンバーの役割は、主に光陰 極の加熱洗浄と NEA 表面活性化である。そのため に、加熱洗浄用のタングステンヒーター、Cs 蒸着 用ディスペンサー、O2蒸着用リークバルブを取り付 けている。真空排気は主にイオンポンプを用いて行 い、粗排気は TMP とロータリーポンプを用いて行 う。粗排気系とプリパレーションチェンバーは ICF70 のオールメタルアングルバルブで仕切る。真 空計測は CCG を用いて行う。ガンチェンバーとプ リパレーションチェンバーは ICF114 のオールメタ ルゲートバルブで繋がれており、カソードはプリパ レーションチェンバーに取り付けられたトランス ファーロッドで両者間を移動できる。

3. 真空試験

現在、HUES1 は写真 1 の状態に組み上げられて いる。TMP、オールメタルアングルバルブ、クライ オポンプ、NEG ポンプ、EXT は取り付けが完了し ており、この状態で真空試験を行った。体積は 0.025m³であり表面積は 0.7m²である。クライオポ ンプは内部にベーキング時の温度が 70℃に制限さ れている部品が使用されている。そのためベーキン グの方法として、クライオポンプの運転をせずに行 うことのできる 70℃ベーキングと、運転をしなが ら行う 200℃ベーキングという2つの方式が考えら れる。どちらの方式でベーキングを行った方が全ガ ス放出速度を抑えられるのかを検証するために、 ベーキング前後の TMP で排気を行っている時点で の真空度、ガンチェンバー内の全ガス放出速度を比 較する。それと共にクライオポンプを運転して排気 を行った場合に 10⁻¹⁰Pa に到達する事が可能なのか も検証した。



写真 1 : 現在の HUES1 の状態

装置を組み上げた後、TMP を用いて粗排気を 行った。ベーキングを行っていないこの状態で、ガ ンチェンバー内の全ガス放出速度を測定するために オールメタルアングルバルブを閉めた。今回の測定 ではガンチェンバー内にクライオポンプと NEG ポ ンプが設置されている。しかし運転及び活性化を 行っていないために排気作用を持っていないと仮定 した。全ガス放出測定を終え、オールメタルアング ルバルブを開けた後クライオポンプを運転した。ク ライオポンプを運転して約1時間半後に、クライオ ポンプが定常運転に入ったのでオールメタルアング ルバルブを締めた。約50時間クライオポンプでガ ンチェンバーを排気した結果 3.2×10⁻⁸Pa という真 空度が得られた。

次にガンチェンバーに 70℃×70 時間のベーキン グを行った。ベーキング中はクライオポンプを運転 せず TMP で真空排気を行った。ベーキング中に NEG ポンプは 70℃まで温められていた。先程と同 じようにガンチェンバー内の全ガス放出速度を測定 した後、クライオポンプでガンチェンバーを排気し た場合の真空度を計測した。その結果、クライオポ ンプを運転してから約 70 時間で 3.5×10⁻⁹Pa という 真空度を得た。

最後に 200℃でのベーキングに臨んだ。我々が使 用するクライオポンプはクライオパネルを冷却しな がらベーキングすることで従来 70℃までしかベー キングすることのできなかった真空容器を 200℃で ベーキングすることが可能である。70℃ベーキング との効果を比較するために 200℃×70 時間のベーキ ングを行った。ベーキング中はクライオポンプを運 転することでクライオポンプ内部を冷やしながら チェンバーの温度を 200℃で保った。TMP を用いて 真空排気を行った。ベーキングを終え温度を室温に 戻していく段階で、クライオポンプ内部の温度が 70℃を超えることがないことを確認してからクライ オポンプを停止した。こうすることでクライオポン プを運転して内部の温度を冷やしたことで、クライ オポンプが吸着してしまったガスを脱離させた。 ベーキング中に NEG ポンプは 120℃まで温められ ていた。先程と同じようにガンチェンバー内の全ガ ス放出速度を測定した後、クライオポンプのみでガ ンチェンバーを排気した場合の真空度を計測した。 その結果、クライオポンプを運転してから約 70 時 間で 1.9×10⁹Pa という真空度を得た。

4. 結果・考察

70℃ベーキングと 200℃ベーキングの効果を比較 するために、ベーキング前後の TMP での真空度を まとめたものを表 1 に示す。全ガス放出速度測定の 結果は図 2、表 2 に示す。

ベーキング温度	ベーキング前真	ベーキング後真
$(^{\circ}C)$	空度(Pa)	空度(Pa)
70°C	1.2×10^{-5}	4.5×10^{-7}
200°C	5.1×10^{-7}	1.0×10^{-7}
表1:ベーキング前後での真空度の比較		



図 2: 全ガス放出速度測定中ガンチェンバー内の真 空度の変化(青:未ベーク、赤:70℃ベーク後、 青:200℃ベーク後)

ベーキング温度	A速度	B速度
(°C)	$(Pa \cdot m^3/s)$	$(Pa \cdot m^3/s)$
未ベーク	1.2×10 ⁻⁸	9.1×10 ⁻⁹
70°C	1.1×10 ⁻⁹	1.1×10 ⁻¹¹
200°C	1.7×10 ⁻¹⁰	1.3×10 ⁻¹²

表2: 全ガス放出速度測定結果

70℃ベーキング後、200℃ベーキング後の測定では、 測定開始直後に急激に真空度が上昇し、その後緩や かな傾きになる様子が測定できた。傾きが急激なも のを A 速度、傾きが緩やかなものを B 速度とした。 70℃ベーキング後、200℃ベーキング後の真空度、 全ガス放出速度を比較した結果、どちらとも 200℃ ベーキング後の方が小さくなっている。次にクライ オポンプによる真空排気試験の結果を重ねたグラフ を図 3 に示す。真空度が時間の経過につれて良く なっていくと仮定し、緑のラインを外挿すると、 200℃ベーキング後にクライオポンプを運転して約 20 日で 10⁻¹⁰Pa 台に到達可能であると考えられる。 200℃ベーキング後に行った真空排気試験中 10⁵ 秒 付近で立っているピークは EXT をデガスしたこと によるピークである。



図 3: クライオポンプ真空試験結果(青:未ベーク、 赤:70℃ベーク後、青:200℃ベーク後)

4. まとめ

参考文献

- [1] "Design Study of Compact ERL", KEK Report 2007-7, 2007
- [2] M. Kuriki et al., Nucl. Instrum. And Methode Phys. A, (inpress)
- [3] M. Kurisu et al., Shinku (In Japanese), 49 (2006) 254
- [4] Y. Matui et al., J Vac Sci Technol, A9, 2010(1991) H.